

## 사고로 인한 불안정한 행동의 요인과 인적요인과의 변화관계 -반도체 산업의 중심으로-

\*윤용구 \*\*박범

\*아주대학교 산업공학과

\*아주대학교 산업시스템공학과

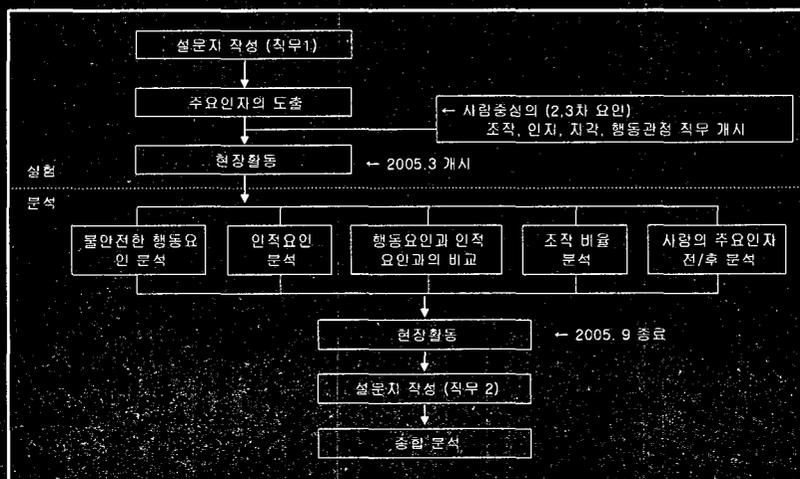
### 1. 연구의 배경

- 반도체산업의 사고의 사람중심의 불안정한 요인을 현장의 합리화를 위한 TFT요원들에게 불안정한 행동요인과 인적오류에 대한 설문지 작성전, 후 즉 실험전, 후를 통해 분석한 결과를 알아본다
- 인적요인을 Rasmussen's model을 근거로 네가지의 요인중에 반도체 산업의 비중있는 항목들을 반영해 분석을 해본다.
- 인적요인의 1차요인을 근거로 상관관계 및 비중이 다소 높은 조작부분에 대한 분석 실시 및 유사한 중요인자의 교육/훈련, 불안정한 행동, 인지에 대하여 실험전, 후의 분석을 해본다.
- 분석의 결과는 반도체 산업에서의 불안정한 행동의 사고요인을 인적요인과 인적오류로 3단계의 전체중에 1단계를 실시하는 과정의 단계로 진행

## 2. 실험의 목적

- Revision된 Reason's model을 검증
- 사람의 사고요인인 2차,3차 요인으로 분석함으로 공통실행의 수행인자를 도출하고 이론과 실험을 통한 검증 실시
- 불안정한 행동과 인적요인 비교와 분석 과 조작과 사람의 주요인자 전/후 비교
- 현장합리화 TFT를 통한 현장활동에 대한 각종요인 전,후의 비교

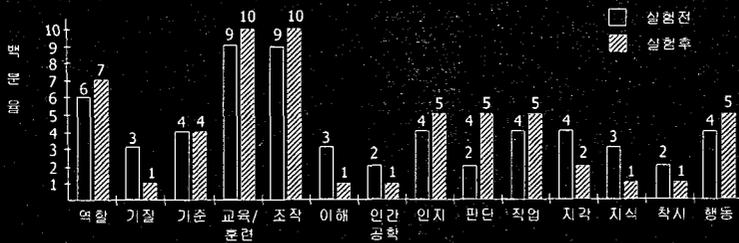
## 3. 실험의 진행절차



#### 4. 실험계획 및 방법

- 1) 실험은 현장 TFT요원의 총30명의 남성피 실험자들이 설문에 참여
- 2) 참여한 피 실험자들의 연령 평균은 32.5세, 표준편차 2.54이며, 연령별 30대 중반(34~63세)의 15명 가장 많고, 30대 초반(30~33세) 10명이었고, 20대 후반(26~29세)가 5명
- 3) 실험에 참여한 피 실험자들은 모두 설비엔지니어로 공정별(Diffusion, Photo, Etch(Wet,Dry), CVD, i2P, Metal) 담당자와 자동제어와 Utility운영하는 담당자로 적게는 8년부터 많게는 16년으로 평균 9.23년, 표준편차는 2.54
- 4) 안전에 대한 개념 있고, 전체 실험의 진행은 <그림53>에서 같이 라인 합리화 하기 전에 활동 TFT 엔지니어에게 현재의 근무경력 및 작업장에서의 불안정한 행동 유무등을 포함한 설문지를 기재.(설문지:직무1) 다만 TFT 활동에 있어 시작되기 전에 사람중심의 사고요인 중에 불안정한 행동 및 사람요인에 관한 수행인자를 분석, 3개월이 지난 후 현장에서의 경험해본 내용을 근거로 재 설문지(직무 2) 조사항으로 실제 경험전과 경험후의 사람중심의 안전사고 즉 수행 인자의 오차 정도를 파악, 유도.

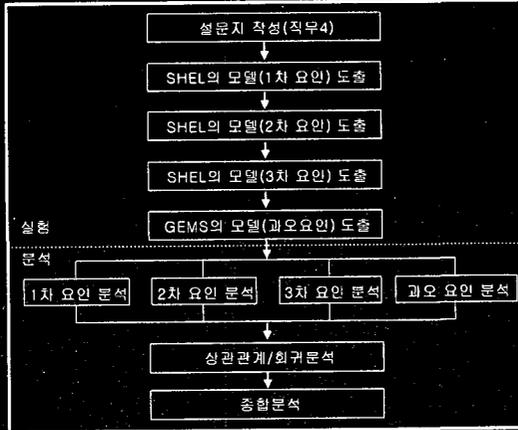
#### 5. 실험계획 및 방법



[ 실험 전,후의 사고원인에 대한 Data ]

- 실험전과 실험후의 피실험자들의 사고원인에 대한 부분차이 발생
- 기준치 이상: 교육/훈련, 조작, 인지, 판단, 행동
- 불안정한 행동: 실험전, 후에 대한 귀무가설 기각할수 없다.  
→ 영향이 다르다고 볼수 없다  
(실험전과 실험후 사고는 동일하게 영향이 있다)  
→ 전: 평균: 43.57, 표준 편차: 23.41  
→ 후: 평균: 41.43, 표준 편차: 32.07
- 교육/훈련, 조작, 인지, 판단, 작업은 실험전, 후의 귀무가설 기각 (대립가설 채택)  
→ 영향이 다르다고 볼수 있다.

### 5. 실험계획 및 방법 - 2



- SHELL : Soft-ware (규범, 절차, 실행), Hard-ware (장비, 설비)  
Environment-ware (정책, 문화), Live-ware (사람, 조직, 관리)
- Reason's Model : Slip, Lapse, Mistake, Violation → GEMS를 이용

### 6. 인적요인 분석

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
실험전	유형	H	E	H	W	H	M	S	En	E	W	E	O	W	M	S	H	M	E	S	En	D	W	O	S	H	En	E	D	O	E
	비율	70	65	60	65	65	75	65	55	60	55	60	70	65	50	55	65	60	65	70	65	75	65	55	60	65	70	75	70	60	55
실험후	유형	H	H	H	E	S	H	S	E	E	H	En	O	W	H	S	En	H	E	En	H	H	W	O	S	H	H	D	W	O	E
	비율	85	75	90	65	85	85	85	75	70	85	70	90	75	90	80	85	80	70	80	80	85	75	80	75	85	90	70	70	75	80

\* Human : H, Equipment : E, Work : W, Material : M, Organization : O, Environment : En, Design : D, System : S

[ 실험전,후의 유형별 및 비율 ]

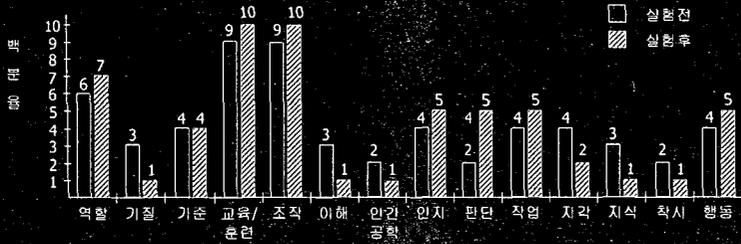
인적요인	실험	
	전	후
사람	5	11
환경	3	3
자재	3	1
조직	3	3
시스템	4	3
작업	4	3
장비	6	5
디자인	2	1

[ 실험전,후의 주기성형 ]

#### ■ 사고유형에 대한 백분율 조사 결과

- 실험전의 사고유형별 비율  
- 평균: 63.67, 표준편차: 6.56
- 실험후의 사고유형별 비율  
- 평균: 76.3, 표준 편차: 5.49
- 결론: 실험후의 현장활동에서의 사고 유형별은 사람측면의 비율이 사고 비율이 높음.

### 7. 불안정한 행동요인과 인적요인(1차)와의 비교



[ 실험 전, 후의 사고원인에 대한 Data ]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
실험전	유형	H	E	H	W	H	M	S	En	E	W	E	O	SW	SW	H	M	E	En	D	W	O	S	H	En	E	D	O	E		
	관용	70	65	60	65	65	75	65	55	60	55	60	70	65	50	65	65	60	65	70	65	75	65	55	60	65	70	75	70	60	55
실험후	유형	H	H	H	E	S	H	S	E	H	En	O	W	H	En	H	E	En	H	W	O	S	H	H	D	W	O	E			
	관용	85	75	90	65	85	85	85	75	70	85	70	90	75	90	80	85	80	70	80	80	85	75	80	75	85	90	70	70	75	80

※ Human : H, Equipment : E, Work : W, Material : M, Organization : O, Environment : En, Design : D, System : S

[ 실험전, 후의 유형별 및 비율 ]

- 실험전: 불안정한 행동과 인적요인(사람, 환경, 자재, 조직, system, 작업, 장비, 디자인) 정규성을 따르지 않고 F-test결과 : 귀무가설을 기각함 → 대립가설을 채택(사고유형이 다르다)
- 실험후: 불안정한 행동과 인적요인 정규성을 따르지 않고 F-test결과 : 귀무가설을 기각 → 대립가설을 채택(사고유형이 다르다)
- 결론: 불안정한 행동과 인적요인(1차)같은 사고에 미치는 영향이 다르다.

### 8. 조직 비율과 분석-1

[ 실험전 ]

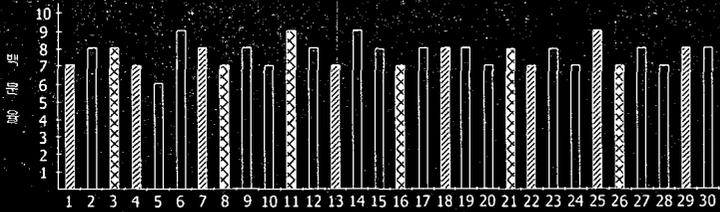


■ 조직에 대한 분류

- 오조직
- 조직미비
- 조직미숙
- 조직못함
- 기타

### 8. 조작 비율과 분석-2

【 실험후 】



- 실험전에는 5분류 실험후에는 3분류

	오조작	조작미비	조작미숙	조작 못함	기타
실험전	40/70(8)	30/60(7)	30/60(7)	40/50(4)	20/40(5)
실험후	60/90(16)	70/90(8)	70/90(6)	-	-

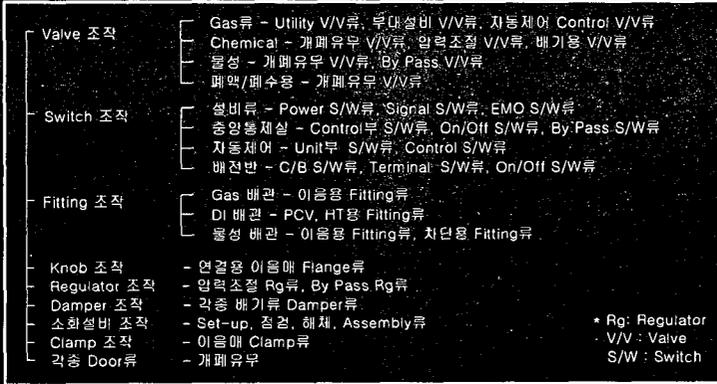
- 결론 : 조작에 대한 사고비율이 높다 → 오조작에 대한 중요성

### 9. 조작의 비교

	조작 전	조작 후
평균	43.67	76.33
편차	10.98	8.09
분산	2	1.48
관측수	30	30
90% CI	(27.30, 38.03)	
자유도	29	
T-Value	12.45	
P-Value	0.000	
조건	$\alpha=0.05$ , 양측검정	
분산	F-Test	Test-Statistics 1.844, P-Value=0.105
	Levene-Test	Test-Statistics 1.195, P-Value=0.0279

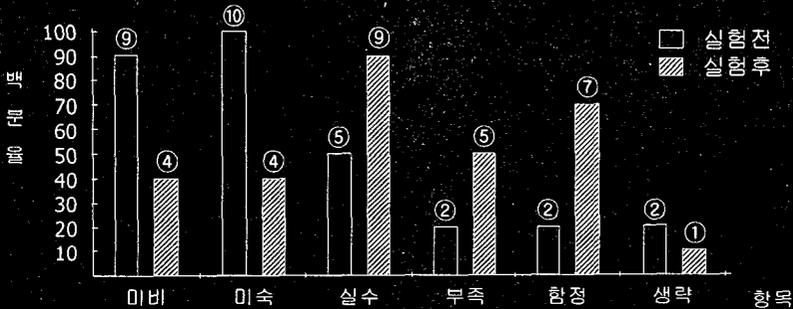
- 결론 : 조작에 대한 사고의 영향성은 P-value(0.05)보다 큼(0.05 < 1.05)  
귀무가설을 기각할 수 없다. (대립가설 채택)  
→ 사고의 영향은 다르다.

### 10. 조작의 계통도



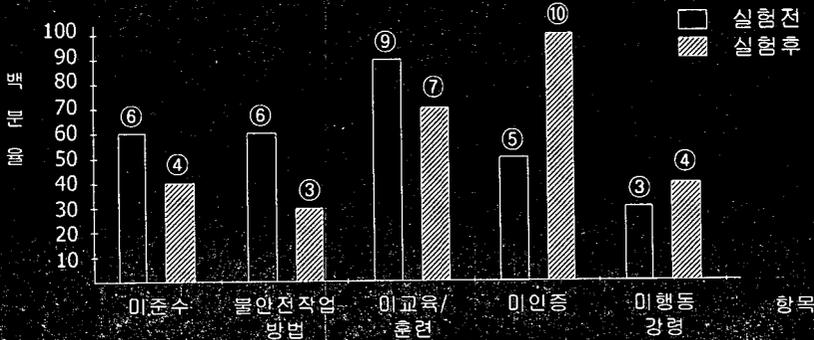
- 사고의 사람중심의 관점에서 조작에 대한 많은 부분에 안전사고의 비율이 잠재.
- 실험전,후의 조작비율이 크게 차이가 남.
- 오조작, 조작미비, 조작미숙 → 중요한 원인이 됨.

### 11. 중요인자의 유사분석 - 교육/훈련



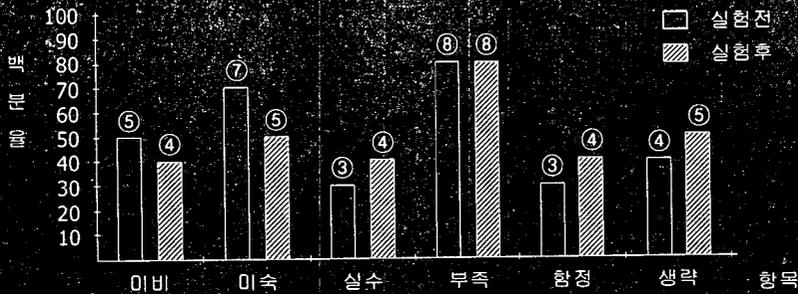
- 실험전은 평균 : 50, 표준편차 : 36.9, 실험후는 평균 : 50, 표준편차 : 27.6
- 결론 : 실험전,후에 대한 ANOVA 검정 결과 P값이 0.05보다 큼  
귀무가설을 기각할 수 없음  
→ 교육/훈련은 동일하다 (실험전/후)
- 실수, 함정, 부족 → 두드러짐  
→ 직무환경, 직무특성, 작업자 특성, 조직, 사회적요소 영향

11. 중요인자의 유사분석 - 불안정한 행동



- 실험전은 평균 : 50, 표준편차 : 21.68, 실험후는 평균 : 56, 표준편차 : 28.8
- 결론 : 실험전, 후에 대한 ANOVA 검정 결과 P값이 0.05보다 큼  
 귀무가설을 기각할 수 없음  
 → 불안정한 행동은 동일하다
- 실험전 : 미준수, 불안정한 작업방법, 실험후 : 미인증과 미행동강령 → 두드러짐  
 → 기준설정 / 의식화 / 역할 / 기질

11. 중요인자의 유사분석 - 인지



- 실험전은 평균 : 50, 표준편차 : 20.98, 실험후는 평균 : 50, 표준편차 : 15.49
- 결론 : 실험전, 후에 대한 ANOVA 검정 결과 P값이 0.05보다 큼  
 귀무가설을 기각할 수 없음  
 → 인지는 동일하다
- 실험전 : 미비, 미숙, 부족 → 장애요인, 실험후 : 실수, 함정, 생략 → 두드러짐  
 → 개인의 Skill

## 12. 결론

- TFT 요원의 실험전, 후 결과
  - 사람 관점의 불안정한 행동의 요인 : 14가지 도출
    - 실험전, 후 결과 사고의 영향이 동일하다.
    - 교육/훈련, 조작, 인지, 작업은 실험전, 후 결과 사고의 영향이 다르다
- 인적요인 분석
  - Reason's Model을 반도체산업에 맞게 분석

Soft-ware	Hard-ware	System-ware	Live-ware
시스템, 디자인	자재, 장비	환경, 작업	사람, 조직

∴ Live-ware : 사람의 비율이 사고의 비율이 높음
- 행동의 요인과 인적요인의 분석
  - 실험전, 후의 사고 유형이 다르다
- 교육/훈련, 조작, 인지에 세부분석을 위한 분석
  - 실험전, 후의 작업전, 후 영향이 같다
  - ① 조작 : 실수, 함정, 부족
  - ② 행동 : 기준, 의식, 역할
  - ③ 인지 : 미비, 미숙, 부족이 두드러짐

## [ 참고문헌 ]

1. Yong G.Yoon., "A Model development of Analysis and prevent for injury in the Semiconductor Industry", Ajou University, pp34~36, 2002.
2. Yong G. Yoon, and Sung M. Hong and Poem. Park., "A study for Human Error Prevention of Chemical Plant", Journal of the Safety Management & Science, vol.6(2), pp.1~6, 2004(a).
3. Yong G. Yoon, and Poem. Park., "The Accident Analyze of a Pointed -End Equipment for Human Error", Journal of the Safety Management & Science, vol.6(4), pp.1~6, 2004(b).
4. Yong G. Yoon, Sung M. Hong, Je S. Son, Poem. Park., "A Study of Injury Prevention for PSM Example research in the Semiconductor industry", Journal Of The Korean Institute Of Plant Engineering, Vol.8(2), 2003.
5. Yong G. Yoon, and Poem. Park., "A Fault-Tree analysis for an End-pointed Equipment ARM-Safety accident", spring season conference Journal of the Safety Management & Science, session (6: safety reliabiliy estimate), 2005(a).
6. Yong G. Yoon, and Poem. Park., "A safety accident analysis pattern model research of a end-pointed industry", fall season conference Journal of the Safety Management & Science, session(2: safety management), 2005(b).
7. Yong G. Yoon., "Semiconductor Equipment-heat Prevention System Management", 12 Th Annual ISESH Conference Portland, Oregon June 19-23, Kent Room B, Session II, 2005.
8. Yong G. Yoon, and Poem. Park., "A method and analysis of human -error management of a semiconductor", industry Journal of the Safety Management & Science, vol.8(1), pp.21~26, 2006(a).